

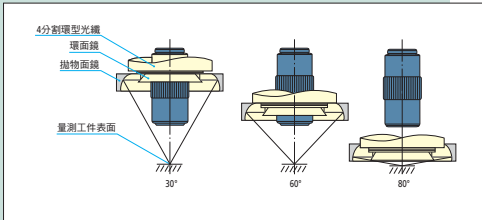


標準隨附檢查成績書。  
詳情請參閱U-7頁。

- 本CNC影像測定機可有效率、正確地進行生產性高的自動量測，並支援尺寸量測到形狀分析。
- 可簡單編輯量測程式，支援對工件的形狀變更與NG處的修正等。
- 也支援輪廓形狀分析，及非接觸3D量測等高難度的需求。
- 搭載TAF（自動追蹤對焦）的機種，可自動追蹤高度變化，減少停止動作，成功縮短量測時間。

### ■ 程式控制環光照明（PRL）

除了可在30°~80°的範圍內控制照射角度，也可獨立設定前後左右4個方向的光量。



可強調微小的段差部分與斜面的對比，發揮效果。

## Quick Vision (CNC影像測定機) QV Apex/Hyper QV



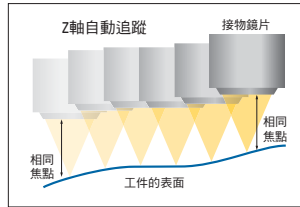
QV Apex302



Hyper QV 404

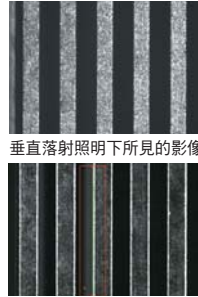
### ■ 自動追蹤變焦（TAF）

是可配合工件的高度變化，進行連續對焦的功能。透過自動追蹤表面的起伏、彎翹（Z軸高度方向），成功提升了量測處理量。透過雷射自動對焦（LAF），可量測高度。註：無法進行位移的連續量測。



雷射光源	半導體雷射 波長690nm
雷射安全性	符合Class2 (JIS C6802:2011, EN/IEC60825-1:2007) 標準
自動對焦方式	對物鏡同軸方式 邊緣對焦法

### IC封裝端子部的底面寬度量測例

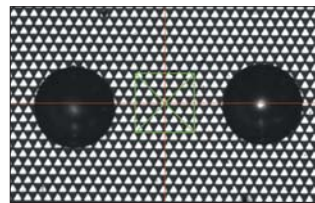


垂直落射照明下所見的影像  
程式控制環光照明下所見的影像

### ■ 高性能複合自動對焦

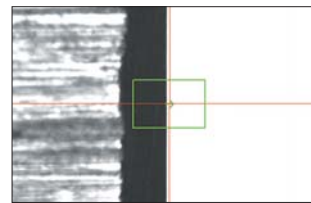
QV系列標準配備高性能影像自動對焦，可用影像自動對焦保證Z軸的精度。具有多種自動對焦工具，可依表面形狀與量測部位，選擇最適的對焦方式，達到可靠性較高的高度量測。

#### 圖形對焦



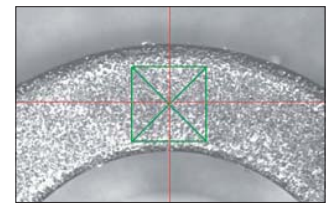
投射圖形的圖形對焦，即使在對比較低的透明體和鏡面上，也可進行對焦。

#### 邊緣對焦



邊緣對焦可確實進行邊緣部的對焦。

#### 表面對焦



表面對焦可量測平均高度。特長是不易受到表面形狀影響。

### ■ 規格

#### QV Apex

項目	名稱	QV Apex302	QV Apex404	QV Apex606
量測範圍 (X×Y×Z)		300×200×200mm	400×400×250mm	600×650×250mm
觀察裝置		程式控制電動砲塔 1×-2×-6×		
攝影元件		從B&W CCD (1/2型) 與3CCD彩色 (1/3型) 中擇一		
量測精度 *1	E1	X、Y軸	(1.5+3L/1000) μm	
		Z軸	(1.5+4L/1000) μm	
	E2	XY平面	(2.0+4L/1000) μm	

Hyper QV (沒有記載的規格項目與QV Apex相同。)

項目	名稱	Hyper QV302	Hyper QV404	Hyper QV606
攝影元件		B&W CCD (1/2型)		
量測精度 *1	E1	X、Y軸	(0.8+2L/1000) μm	
		Z軸	(1.5+2L/1000) μm	
	E2	XY平面	(1.4+3L/1000) μm	

\*1：以本公司檢查方法。L為任意2點間的尺寸 (mm)



詳情請參閱「Quick Vision」  
型錄 No.TC14007。

(外觀・規格・價格等會因為商品改良的緣故，  
有時會有些許的變更，敬請見諒。)